



Design of a type of optical spectrometer in the UV- A spectral region

A. Rezaei-latifi ^{*}

Associate Professor, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

(Received: 19/05/2023 revised: 07/08/2023 Accepted: 12/09/2023 published: 07/11/2023)

DOI:<https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455153.1402.11.2.12.5>

Abstract

An optical spectrometer is a tool used to separate an electromagnetic radiation into its wavelength components and has a variety of applications in science and industry. . In this paper, an optical spectrometer in the UV-A spectral region, which has not been investigated before, is designed. For this design, a holographic diffraction grating with a groove density of 3600 lines/mm and a number of lenses with different materials suitable for the ultraviolet region are used. To achieve high contrast and resolution, the beams of each wavelength scattered by the grating must be carefully focused on the detector screen. For this purpose, eight lenses made of silica and fused silica, which have a high transfer coefficient in the ultraviolet region, were used. Then, after the initial calculations and determining the estimated radius of curvature of the surfaces, in order to achieve the desired results, the lenses were placed at a distance of 1 mm from each other and by using appropriate operands defined in the merit function editor of Zemax software, the thickness of the surfaces and the radius of curvature of the lenses was optimized in several stages . After optimization, at the central wavelength, all points of the spot diagram were located inside the Airy disk and the resolution of approximately 30 pm was obtained, which is a very good result compared to the previous works of researchers in other areas of the electromagnetic spectrum.

Keywords: Spectrometer, Diffraction grating, UV-A, Resolution, Spot diagram, Airy disk

* Corresponding author E-mail: r_latifi@hormozgan.ac.ir



طراحی یک نوع طیف سنج اپتیکی بهینه در ناحیه طیفی UV-A

علی رضائی لطیفی*

دانشیار، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

(دریافت: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹، بازنگری: ۱۴۰۲/۰۵/۱۶، پذیرش: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱، انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶)

DOI: <https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455153.1402.11.2.12.5>

* این مقاله یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت شرایط و ضوابط مجوز Creative Commons Attribution (CC BY) توزیع شده است.

نویسندهان

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

طیفسنج یا اسپکترومتر اپتیکی ابزاری است که برای جداسازی و تفکیک یک تابش الکترومغناطیسی به مولفه‌های طول موجی اش مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربرد متنوعی در علوم و صنایع دارد. در این مقاله یک اسپکترومتر اپتیکی منحصرأ در ناحیه طیفی UV-A که قبلاً مورد تحقیق قرار نگرفته است طراحی شده است. برای این طراحی، از توری پراش هولوگرافی با چگالی شیار ۳۶۰۰ خط بر میلی متر و تعدادی عدسی با جنس‌های مختلف مناسب در ناحیه فرابنفش استفاده شده است. برای رسیدن به کتراست و توان تفکیک بالا باید پرتوهای مربوط به هر طول موج پراشیده شده توسط توری، بادقت بالاتر بر روی صفحه آشکارساز کانونی شوند. برای این منظور هشت عدسی از جنس‌های سلیکا و سلیکای ذوب شده که دارای ضریب انتقال بالایی در ناحیه فرابنفش هستند به کار برده شد. سپس بعد از محاسبات اولیه و تعیین تخمینی شعاع انحنای سطوح، جهت رسیدن به نتایج مطلوب، عدسی‌ها را به فاصله ۱ میلی‌متر از هم قرارداد و با کمک عملوندهای مناسب تعریف شده در ویرایشگرتابع شایسته نرم‌افزار زیمکس، ضخامت سطوح و شعاع انحنای عدسی‌ها در چند مرحله بهینه‌سازی شدند. پس از بهینه‌سازی، در طول موج مرکزی، تمام نقاط نمودار نقطه‌ای داخل دیسک ایری واقع شدند و توان تفکیک سامانه تقریباً ۳۰ پیکومتر به دست آمد که در مقایسه با کارهای قبلی محققان در سایر نواحی طیف الکترومغناطیسی، نتیجه بسیار مطلوبی است.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه‌ها: طیفسنج، توری پراش، فرابنفش نزدیک، توان تفکیک، نمودار نقطه‌ای، دیسک ایری.

گاهی در میان مؤلفان بین طیفسنج (اسپکترومتر) و اسپکتروفوتومتر یک سردرگمی دیده می‌شود و این دو با هم اشتباه گرفته می‌شود. با این حال، یک تفاوت اساسی بین اسپکترومتر و اسپکتروفوتومتر وجود دارد. اسپکترومتر وسیله‌ای است که برای توصیف ماده بر اساس طول موج‌های شناسایی شده در طیف استفاده می‌شود، درحالی که اسپکتروفوتومتر ماده را بر اساس شدت نور در هر طول موج درگیر در برهم‌کنش نور با ماده (جذب، بازتاب، عبور) تجزیه و تحلیل می‌کند. در واقع اسپکترومتر قسمتی از اسپکتروفوتومتر است. یک اسپکتروفوتومتر از دو ابزار تشکیل شده است، یک اسپکترومتر برای ایجاد طول موج‌های مختلف با توان تفکیک معین و یک فوتومتر برای اندازه‌گیری شدت نور هر طول موج [۱۵-۱۷]. بنابراین اسپکترومتر نور را دریافت می‌کند و آن را بر اساس طول موج جدا می‌کند و طیفی ایجاد می‌کند که شدت نسبی این طول موج‌های جداگانه توسط فوتومتر اندازه‌گیری می‌شود. طیفسنج‌های نوری معمولاً شامل یک شکاف ورودی، یک توری

۱- مقدمه

طیفسنج ابزاری است که اجزای طیفی یک موج الکترومغناطیسی را جدا و اندازه‌گیری می‌کند. طیفسنج اپتیکی برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک ماده بر اساس نور مرئی، فرابنفش و فروسرخی که از آن خارج می‌شود، استفاده می‌شود و می‌تواند در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد [۱۱-۱۰]. در این میان دامنه کاربردهای انواع طیفسنج‌های اپتیکی VIS-UV به سرعت در حال گسترش است و در طی سال‌های اخیر کاربردهای جدیدی گزارش شده است. سادگی، دقت و مقرر به صرفه بودن به محبوبیت این روش در زمینه‌هایی مانند داروسازی، علوم زیستی، مواد غذایی، مطالعات محیطی، پژوهشی قانونی و کائی‌شناسی کمک زیادی کرده است [۱۱-۱۴].

می‌شود. طیفسنج UV-A می‌تواند در اسپکتروفوتومترهای UV-A برای اندازه‌گیری کمی و کیفی انواع مواد معدنی و آبی که جاذب تابش UV-A هستند مورد استفاده قرار بگیرد و در زمینه‌های مختلف صنعتی، پزشکی و تحقیقات علمی مانند کنترل کیفیت مواد خام و ترکیبات بیولوژیکی، تعیین توزیع و ساختار اجزای تشکیل‌دهنده اتمسفر و تعیین ترکیب داروهای مختلف بکار بردشود. تا کنون عده طیفسنج‌های اپتیکی جهت کاربرد در ناحیه طیفی مرئی طراحی و ساخته شده‌اند و پهنه‌ای باند بعضی از آنها قسمتی از ناحیه فرابنفش و یا فروسرخ را هم در بر می‌گیرد. ولی هر چه پهنه‌ای باند گسترده‌تر باشد، به دلیل افزایش مقدار ایپراهی‌ها، محدودیت بیشتری در افزایش دقت و قدرت تفکیک میانگین ایجاد می‌شود. تصحیح ایپراهی‌ها برای طول موج کوتاه‌تر دشوارتر است؛ زیرا قطر (شعاع) دیسک ایری با طول موج رابطه مستقیم دارد (سکشن ۳ را ببینید) و ازین‌رو برای عدد f یکسان شاعع دیسک ایری در ناحیه فرابنفش نسبت به ناحیه مرئی کوچک‌تر است؛ بنابراین نسبت شاعع RMS به شاعع دیسک ایری در ناحیه فرابنفش بزرگ‌تر از ناحیه مرئی است. یعنی در ناحیه طیفی فرابنفش، ایپراهی‌ها در مقایسه با ناحیه مرئی ضعیفتر تصحیح می‌شوند که معمولاً باعث می‌شود در این ناحیه قدرت تفکیک‌پذیری ضعیفتر باشد. هدف اصلی این تحقیق طراحی یک طیفسنج اپتیکی باقدرت تفکیک بالا منحصرًا در پهنه‌ای باند طیفی UV-A می‌باشد که قبلًا مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. عناصر اپتیکی به کاررفته در این طراحی شامل توری پراش هولوگرافی با تعداد شکاف ۳۶۰۰ در میلی‌متر و برخلاف بیشتر طراحی‌های محققان قبلی در این کار جهت ایجاد دسته پرتو موazی و کانونی کردن پرتوها روی آشکارساز، به جای آینه، از تعدادی عدسی مناسب نور فرابنفش استفاده می‌شود که باعث می‌شود به توان تفکیک بالاتری دست یابیم. در ادامه مقاله، ابتدا مواد و عناصر بکار رفته و روش انجام طراحی تشریح می‌شود و سپس نتایج بدست آمده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

۲- مواد و روش طراحی

عناصر اصلی این طراحی عبارت‌اند از ۱- عدسی موازی‌ساز یا کلیماتور ۲- توری پراش ۳- عدسی‌های کانونی ساز ۴- آشکارساز (صفحه تصویر). جهت موازی‌سازی نور گسیل شده از چشمۀ نقطه‌ای، از یک عدسی دوتایی با فاصله کانونی مؤثر $50/7$ میلی‌متر و فاصله کانونی جلویی 43 میلی‌متر و قطر 27 میلی‌متر از شرکت اپتوسیگما استفاده می‌کنیم. جنس شیشه‌های این عدسی از سیلیکا است. شیشه سیلیکا دارای ضریب انبساط حرارتی بسیار کم با کیفیت نوری خوب و انتقال‌دهنده عالی در منطقه فرابنفش است؛ بنابراین چشمۀ نقطه‌ای را در فاصله 43 میلی‌متری این عدسی دوتایی قرار می‌دهیم تا دسته پرتو موازی جهت ورود به توری پراش ایجاد شود. پهنه‌ای

پراش یا منشور، یک آشکارساز و تعدادی آینه یا عدسی هستند و ممکن است دارای فیلترهایی جهت حذف سیگنال‌های ناخواسته باشد. علاوه بر مشخصاتی مانند حجم، وزن و هزینه ساخت که برای هر سامانه‌ای دارای اهمیت نسبی است برای یک طیفسنج اپتیکی قدرت تفکیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و طراحان سعی می‌کنند در پهنه‌ای باند موردنظر سامانه را باقدرت تفکیک بالایی طراحی کنند. توان یا قدرت تفکیک طیفسنج که به آن وضوح Hm می‌گویند حداقل فاصله بین دو خط طیفی مجاور روی آشکارساز است که سامانه به عنوان دو طول موج مجزا از هم تشخیص می‌دهد.

اشعه فرابنفش UV قسمتی از طیف تابش الکترومغناطیسی با طول موج تقریباً 180 تا 400 نانومتر می‌باشد و معمولاً به باندهای طیفی زیر تقسیم‌بندی می‌شود: [۱۸]:

UV-A (فرابنفش نزدیک)، طول موج $315-400$ نانومتر

UV-B (فرابنفش متوسط)، طول موج $280-315$ نانومتر

UV-C (فرابنفش دور)، طول موج $180-280$ نانومتر

ابرها و گازهای موجود در جو تمام تابش UV-C و 90 درصد اشعه UV-B را جذب می‌کنند [۱۹]. بنابراین، تنها اشعه A و UV-A مقدار کمی از اشعه UV-B که از خورشید ساطع می‌شود به سطح زمین می‌رسند. ازین‌رو، UV-A اصلی‌ترین مؤلفه تابش خورشیدی در ناحیه فرابنفش است و تأثیر بیولوژیکی مهمی بر موجودات زنده دارد.

در سال‌های اخیر تعدادی اسپکترومتر اپتیکی در ناحیه مرئی و فرابنفش توسط محققان طراحی شده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۲ ریزنبرگ و همکارانش [۲۰] با کمک توری اپتیکی و آرایه‌ای از سیستم‌های میکروالکترومکانیکی MEMS یک نوع اسپکترومتر کوچک در ناحیه مرئی-فرابنفش با توان تفکیک $1,2$ نانومتر طراحی کردند. در سال ۲۰۱۸ گودانگ و همکارانش [۲۱] بر اساس ساختار نامتقارن و به کمک توری پراش و آینه‌های کاویک طیفسنج قابل حمل در ناحیه مرئی-فرابنفش با تفکیک‌پذیری 200 تا 900 نانومتر طراحی کردند. در سال ۲۰۱۹ سونگ هون او و همکارانش [۲۲] یک طیفسنج پلیمری یکپارچه ساخته شده توسط لیتوگرافی چاپی UV که دارای توان تفکیک 5 نانومتر برای محدوده طول موج $400-650$ نانومتر بود، پیشنهاد کردند. مازل طیفسنج یکپارچه پیشنهادی آنان شامل یک موجبر نوری مسطح با یک آینه مقعر، یک شبکه پراش نانو مسطح با گام غیریکنواخت، یک فیبر نوری و یک آرایه دیود نوری بود.

در این کار به کمک نرم‌افزار زیمکس یک اسپکترومتر در ناحیه طیفی فرابنفش نزدیک یعنی باند طیفی $400-315$ نانومتر طراحی

بعد از جداسازی طول موج‌های مختلف اکنون باید هر طول موج در یک نقطه صفحه تصویر (آشکارساز) کانونی شود. کانونی سازی هم‌زمان طول موج‌های مختلف پرتو پراشیده توسط یک عدسی منفرد به طور مطلوب شدنی نیست؛ بنابراین در این کار از هشت عدسی از جنس‌های سلیکا و سلیکات ذوب شده استفاده شد که نحوه چیدمان و تعیین شعاع انحنای آنها در زیر توضیح داده می‌شود.

می‌خواهیم فاصله کانونی سیستم اپتیکی کانونی ساز ما حدود ۴۰ میلی‌متر بشود؛ لذا توان اپتیکی آن ۲۵ دیوبتر خواهد بود. برای این کار اگر از ۸ عدسی نازک کنار هم استفاده کنیم توان هر کدام $\frac{3}{1}$ دیوبتر خواهد بود. چنانچه هر کدام از این عدسی‌ها را دو کوش با شعاع انحنای یکسان در نظر بگیریم شعاع انحنای آنها برابر خواهد با [۲۵]:

$$R = \frac{2(n-1)}{\phi} = 320 \text{ mm}$$

در رابطه فوق ϕ توان اپتیکی و n ضریب شکست سلیکا در طول موج مرکزی است. اکنون این هشت عدسی دو کوش که یک‌درمیان از جنس سلیکا و سلیکات ذوب شده هستند با شعاع فوق، خاصت سه میلی‌متر و فاصله یک میلی‌متر از هم‌دیگر قرار می‌دهیم و سپس جهت رسیدن نتیجه مطلوب به کمکتابع شایسته و عملوندهای^۱ مناسب در نرمافزار زیمکس، سیستم کانونی ساز را بهینه‌سازی می‌کنیم. بهینه‌سازی را در دو مرحله اصلی انجام می‌دهیم. در مرحله اول فاصله بین عدسی‌ها را متغیر در نظر می‌گیریم و به کمک عملوندهای TRAC و سایر عملوندهای در ویرایشگر تابع شایسته بهینه‌سازی کلی را انجام می‌دهیم و سپس جهت رسیدن به نتایج مطلوب‌تر هر بار شعاع برخی عدسی‌ها را متغیر گرفته و بر روی سیستم بهینه‌سازی محلی انجام می‌دهیم. در فرایند بهینه‌سازی تلاش بر این است که تابع شایسته MF را به مقدار مینیمم ممکن برسانیم. تابع شایسته طبق رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$MF^2 = \frac{\sum W_i(V_i - T_i)^2}{\sum W_i}$$

که در رابطه فوق W_i وزن آمین عملوند، V_i مقدار جاری عملوند و T_i مقدار هدف عملوند می‌باشدند. در بهینه‌سازی با تغییر متغیرهای سامانه مانند جدایی بین عدسی‌ها و شعاع عدسی‌ها، مقدار جاری عملوندها به مقدار هدف آن نزدیک می‌شوند. عملوند TRAC میانگین شعاعی همه پرتوهای گسیل شده از یک نقطه چشم را در یک طول موج معین نسبت به مرکز محاسبه می‌کند و مقدار هدف آن در فرایند بهینه سازی صفر در نظر گرفته می‌شود.

باند چشمۀ موج مطابق با باند طیفی UV-A از ۳۱۵ نانومتر تا ۴۰۰ نانومتر انتخاب شده است.

از توری پراش جهت جداسازی طول موج‌های مختلف نور استفاده می‌شود. پس از خروج موج از توری، پرتوهای نور در هر طول موج موازی خواهند بود. در این طراحی یک توری پراش عبوری به چگالی شیار $3600 \times 25 \text{ میلی‌متر}$ با ابعاد $25 \times 25 \text{ میلی‌متر}$ و زیر لایه شیشه کوارتز که مناسب ناحیه طیفی فرابنفش است به کار برده شده است.

اگر مطابق شکل (۱) دو پرتو موازی فرودی بر دو شکاف مجاور با زاویه‌های تابش و پراش α و β در نظر بگیریم در این صورت اختلاف راه این دو پرتو برابر است با [۲۳ و ۲۴]:

$$\Delta S = d(\sin\alpha + \sin\beta) \quad (1)$$

برای تداخل سازنده باید اختلاف راه مضرب صحیحی از طول را مساوی یک در نظر m اگر $\Delta S = m\lambda$ موج باشد یعنی بگیریم در این صورت

$$d(\sin\alpha + \sin\beta) = \lambda \quad (2)$$

رابطه بالا نشان می‌دهد که برای α و d ثابت با تغییر طول موج، زاویه پراش β تغییر می‌کند بنابراین در پهنه‌ای طیفی UV- طول موج‌های مختلف پس از عبور از توری با زاویه‌های پراش متفاوت از هم جدا می‌شوند.

اگر زاویه تابش را طوری در نظر بگیریم که مساوی زاویه پراش برای طول موج مرکزی λ_0 باشد در این صورت خواهیم داشت

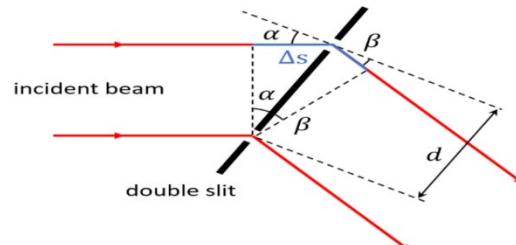
$$\sin\alpha = \frac{\lambda_0}{2d}$$

باتوجه به اینکه در این طراحی چگالی شیار برابر با 3600 mm بر میلی‌متر است لذا $d = \frac{1}{3600} \text{ mm}$ و بعلاوه طول موج مرکز $\lambda_0 = 357.75 \text{ nm}$ است لذا $\lambda_0 = 0.64395 \text{ nm}$ و در نتیجه $\alpha = 40.087^\circ$

باتوجه به مقدار α و d زاویه پراش مربوط به ابتدا و انتهای طیف به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\lambda = 315 \text{ nm} \rightarrow \beta_{min} = 27.9921^\circ$$

$$\lambda = 400 \text{ nm} \rightarrow \beta_{max} = 56.8802^\circ$$



شکل (۱): مبانی نظری توری پراش با دو شکاف [۲۳]

شعاعی هر سطح از محور اپتیکی که در آن تمام پرتوهای نور فرود می‌آیند را مشخص می‌کند. سطوح شکست مختصات سطوح فیزیکی نیستند و در این سطوح پرتوهای نور شکست و یا بازتاب پیدا نمی‌کنند. از این سطوح برای تعریف کردن یک سیستم مختصات جدید بر حسب سیستم مختصات موجود و برای چرخش یک سطح حول محورهای مختصات یا جابه‌جاکردن سطح نسبت به محور اپتیکی استفاده می‌شود.

پس از انجام فرایند بهینه‌سازی، داده جدول ۱ را برای طراحی سامانه اسپکترومتر به دست می‌آوریم. در این جدول شعاع هر سطح در ستون مربوط به شعاع مشخص شده است. شعاع صفحه تصویر و توری پراش بینهایت است؛ چون دارای سطح تخت می‌باشند. ضخامت هر سطح فاصله بین رأس هر سطح تا سطح بعدی است. ستون جنس شیشه نوع ماده هر سطح عدسی تا سطح بعدی را مشخص می‌کند. ستون نیم قطر فاصله

جدول (۱): داده طراحی سامانه اسپکترومتر

شماره سطح	نوع سطح	شعاع (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)	جنس شیشه	نیم قطر (میلیمتر)	میکرومتر/خط	مرتبه پراش	چرخش حول محور (درجه) X
شی	استاندارد	بینهایت	۴۳/۰۰		.			
۱	استاندارد	۵۴.۴۰۰	۲/۰۰	SILICA	۱۳/۰۰			
۲	استاندارد	۳۴.۵۰۰	۱/۴۰		۱۳/۰۰			
۳	استاندارد	۶۷.۹۶۷	۹/۰۰	SILICA	۱۳/۰۰			
۴	استاندارد	-۲۸/۵۹۰	۳۰/۰۰		۱۳۶۴			
۵	شکست مختصات		.		.			۴۰/۰۸۷
۶	استاندارد	بینهایت	۱/۵۰	QUARTZ	۱۲/۵۰			
۷	توری پراش	بینهایت	۱/۵۰	QUARTZ	۱۲/۵۰	۳/۶۰	-۱	
۸	استاندارد	بینهایت	.		۲/۰۶۸			
۹	شکست مختصات		.		.			۴۰/۰۸۷
۱۰	استاندارد	بینهایت	۲۸/۷۵۵	SILICA	۱/۷۸۵			
۱۱	استاندارد	-۱۴۱/۲۲۵	۳/۰۰		۷/۷۶۵			
۱۲	استاندارد	-۷۶/۷۴۲	۰/۰۱	F_SILICA	۸/۲۳۸			
۱۳	استاندارد	-۴۰۰/۰۰۰	۳/۰۰		۸/۳۶۵			
۱۴	استاندارد	۴۰۰/۰۰۰	۰/۱۰	SILICA	۸/۷۲۷			
۱۵	استاندارد	۳۰۱/۷۴۲	۳/۰۰		۸/۷۸۵			
۱۶	استاندارد	۱۴۶/-۰۵۷	۱/۷۷۶	F_SILICA	۹/۰۷۴			
۱۷	استاندارد	۱۵۴/۵۵۷	۳/۰۰		۹/۳۸۹			
۱۸	استاندارد	-۳۴۴/۷۸۱	۱/۴۳۲	SILICA	۹/۵۷۴			
۱۹	استاندارد	۹۴/۸۳۵	۳/۰۰		۹/۷۶۴			
۲۰	استاندارد	۵۲۹/۹۶۴	۸/۰۱۵	F_SILICA	۹/۸۳۹			
۲۱	استاندارد	۷۱/۵۱۴	۳/۰۰		۱۰/۲۸۴			
۲۲	استاندارد	۳۹۹/۸۲۴	۲/۳۴۲	SILICA	۱۰/۲۵۶			
۲۳	استاندارد	۴۰۰	۳/۰۰		۱۰/۲۴۴			
۲۴	استاندارد	-۴۰۰	۲/۰۳۰	F_SILICA	۱۰/۲۱۲			
۲۵	استاندارد	۴۰۰	۳/۰۰		۱۰/۱۳۷			
۲۶	استاندارد	-۱۷۴/۹۶۶	۲۶/۵۰۹	SILICA	۱۰/۰۶۵			
۲۷	شکست مختصات		.		.			-۷/۹۷۲
تصویر	استاندارد	بینهایت	-		۸/۶۴۳			

کاهش دهیم، اما چنانچه به کمک عملوند SPHA ویرایشگر تابع شایسته در نرم‌افزار زیمکس بخواهیم ابیراهی کروی را برای طول موج مرکزی به مینیمم برسانیم ممکن است ابیراهی کروی برای سایر طول موج‌ها مقدار قابل توجهی باشد؛ لذا با کمک عملوند‌های TRAC^۱ در تابع شایسته پیش‌فرض، سامانه طیفسنچ بهینه‌سازی می‌شود تا مقدار ابیراهی کروی به طور هم‌زمان برای هر کدام از طول موج‌ها به مقدار قابل قبولی کاهش یابند. جدول (۲) مقدار ضریب ابیراهی سیدل برای ابیراهی کروی در ۵ طول موج مختلف پس از بهینه‌سازی سامانه را نشان می‌دهد.

جدول (۲): ضریب ابیراهی کروی سیدل برای طول موج‌های مختلف

ضریب ابیراهی کروی سیدل	طول موج
$w_{040}=0.0205\lambda_1=0.00645 \mu m$	$0.31500=\lambda_1 \mu m$
$w_{040}=0.019155\lambda_2=0.00644 \mu m$	$0.33625=\lambda_2 \mu m$
$w_{040}=0.017985\lambda_3=0.00643 \mu m$	$0.35775=\lambda_3 \mu m$
$0.00642 \mu m=w_{040}=0.016970\lambda_4$	$0.37875=\lambda_4 \mu m$
$0.00642 \mu m=w_{040}=0.016052\lambda_5$	$0.40000=\lambda_5 \mu m$

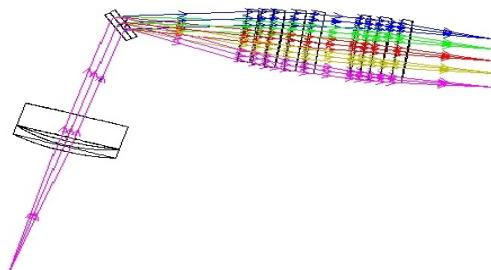
شکل (۴) نمودار نقطه‌ای تصویر برای طول موج مرکزی 0.35775 میکرومتر نشان می‌دهد. شعاع RMS^۲ و شعاع هندسی نمودار به ترتیب برابرند با $3/675$ و $5/404$ میکرومتر. شعاع RMS شعاع آماری پرتوها در نمودار نقطه‌ای نسبت به پرتو اصلی است و شعاع هندسی حداقل شعاع دایره‌ای با مرکزیت پرتو اصلی در نمودار نقطه‌ای است که تمام پرتوها در داخل آن واقع می‌شوند.

هنگامی که نور از دیافراگم سیستم اپتیکی می‌گذرد پدیده پراش رخ می‌دهد. الگوی پراش حاصل، یک ناحیه روشن در مرکز، همراه با یک سری حلقه‌های متعدد مرکز باشد روبه کاهش در اطراف آن است که این الگو دیسک ایری^۳ نامیده می‌شود. دیسک ایری در واقع کوچک‌ترین نقطه‌ای است که پرتوها گسیل شده از یک نقطه شی را در غیاب هر نوع ابیراهی می‌توان متتمرکز کرد. قطر دیسک ایری طبق رابطه زیر به طول موج و عدد کانونی کاری ($f/\#$) بستگی دارد [۲۶]:

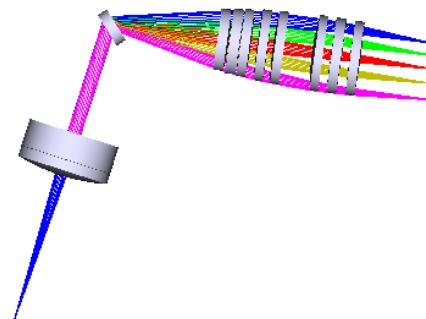
$$B_{diff} = 2.44\lambda(f/\#)$$

۳- نتایج و بحث

شکل‌های (۲) و (۳) به ترتیب طرح بهینه سه‌بعدی و طرح سایه‌دار خروجی مدل را نشان می‌دهند. موج الکترومغناطیسی UV-A با پهنه‌ای طول موج 85 میکرومتر به طیفسنچ وارد می‌شود و پس از خروج از آن به طول موج‌های مختلف تفکیک می‌شود که در اینجا طول موج‌های تفکیکی نشان داده شده از بالاب‌پایین آشکارساز عبارتند از 0.315 ، 0.33625 ، 0.35775 و 0.400 میکرومتر.



شکل (۲): طرح سه‌بعدی مدل

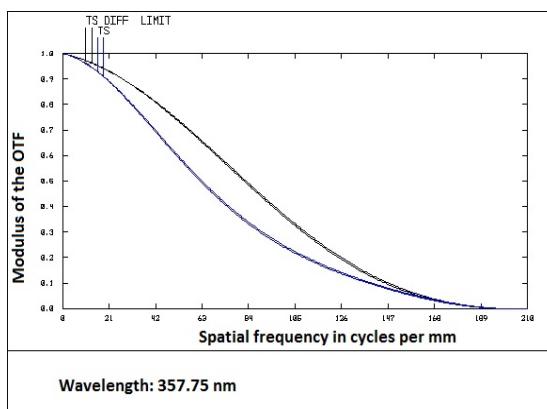


شکل (۳): طرح مدل سایه‌دار

ابیراهی‌های مختلف موجود در هر سیستم اپتیکی مانع بزرگی برای کانونی شدن پرتوهای گسیل شده از هر نقطه شیء یا چشم می‌باشند که این موضوع باعث کاهش کیفیت تصویر می‌شود. در این طراحی چون چشم مه را نقطه‌ای روی محور اپتیکی در نظر گرفته‌ایم با ابیراهی‌های خارج محور مانند کما، واپیچش و آستیگماتیسم مواجه نمی‌باشیم و فقط ابیراهی رنگی و کروی وجود دارند. اما توری طول موج‌های مختلف را از هم جدا می‌کند و در اسپکترومتر برخلاف ادواتی مانند دوربین عکاسی که سعی می‌شود تمام طول موج‌ها در یک نقطه متتمرکز شوند، هر طول موج جداگانه بر روی صفحه تصویر متتمرکز می‌شود. یعنی پس از خروج موج از توری امواج تکفامی ایجاد می‌شوند که هر کدام از این امواج تکفام در نقاط مختلف آشکارساز باید متتمرکز شوند؛ لذا به دلیل تکفام بودن امواج خروجی از توری، ابیراهی رنگی نداریم و صرفاً با ابیراهی کروی مواجه می‌باشیم. بنابراین لازم است برای طول موج‌های مختلف ابیراهی کروی

1-Transverse ray aberration centred
2-Root-mean-square
3-Airy

فرکانس فضایی بر حسب واحد جفت خط بر میلی متر است و محور σ قدر مطلقتابع انتقال فاز (کنتراست) است. یک انسان به طور کلی به کنتراست $1/10$ یا بالاتر نیاز دارد تا بتواند تفاوت خطوط را ببیند. منحنی مشکی نمودار حد پراش است که اگر سیستم اپتیکی مورد نظر، ایده‌آل و بدون ابیراهی باشد، نمودار MTF آن مماس بر این نمودار است. نمودار MTF برای پرتوهای مماسی T (یعنی پرتوهایی که در صفحه قائم قرار می‌گیرند) و پرتوهای پیکانی S (یعنی پرتوهایی که در صفحه افقی قرار می‌گیرند) مجزا رسم می‌شوند ولی در اینجا نمودار این دو پرتو برای طول موج مرکزی تقریباً بر روی هم منطبق شده است. در این شکل نمودار MTF به وضعیت ایده‌آل (حد پراش) نسبتاً نزدیک می‌باشد و نشان‌دهنده این است که تصویر از کنتراست مطلوبی برخوردار است. خروجی مدل نشان می‌دهد که با فاصله از طول موج مرکزی مقداری از کانتراست تصویر کاسته می‌شود ولی نتایج در حد خوبی قابل قبول است.

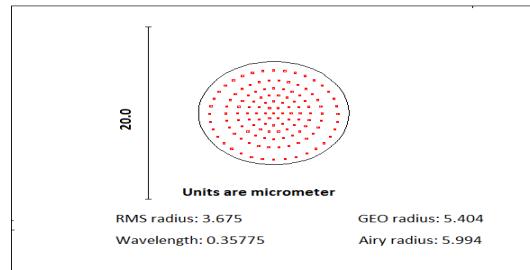


شکل(۶): تابع انتقال مدولاسیون در طول موج مرکزی

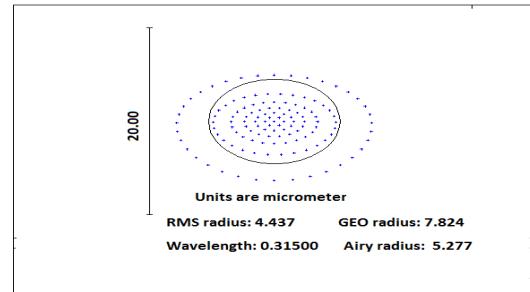
برطبق معیار ریلی اگر فاصله بین دونقطه از جسم از شعاع دیسک ایری بزرگ‌تر باشد آن دونقطه قابل تشخیص است [۲۷]. در طیفسنج به جای دونقطه از جسم دو طول موج مختلف در صفحه تصویر از هم تفکیک می‌شود. در این طراحی طبق شکل (۴) برای طول موج مرکزی شعاع دیسک ایری $5/994$ میکرومتر است. با توجه به اینکه طبق جدول ۱ پهنای آشکارساز یعنی قطر صفحه تصویر به شعاع دیسک ایری عدد 2880 به دست می‌آوریم؛ یعنی این تعداد طول موج در صفحه تصویر از هم قابل تشخیص است. اما پهنای باند این اسپکترومتر 85 نانومتر است؛ بنابراین با تقسیم این پهنای باند به عدد 2880 توان تفکیک دستگاه به دست می‌آوریم که برابر $30 \sim 51$ پیکو متر می‌شود. برای اینکه صحت نتیجه به دست آمده را چک کنیم در این طراحی فقط دو طول موج با اختلاف 30 پیکو متر یعنی $357/75$ و

در این طراحی عدد 4 کاری $13/73$ می‌باشد؛ بنابراین طبق رابطه فوق قطر دیسک ایری $11/98$ میکرومتر و شعاع دیسک $5/99$ میکرومتر دست می‌آید.

مقایسه شعاع دیسک ایری با شعاع RMS معیار مناسبی برای بررسی کیفیت تصویر به دست آمده در هر طول موج بر روی آشکارساز است. طبق شکل (۴) قطر دیسک ایری نمودار نقطه‌ای بزرگ‌تر از شعاع RMS و شعاع هندسی است؛ بنابراین تمام پرتوهای داخل دیسک ایری قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده این است که پرتوهای طول موج مرکزی به طور بسیار مطلوبی کانونی شده‌اند. در سایر طول موج‌ها نیز نقاط نمودار تقریباً تماماً داخل دیسک ایری قرار می‌گیرند؛ ولی در ابتدا و انتهای طیف تعدادی از نقاط در خارج از دیسک ایری قرار می‌گیرند. شکل (۵) نمودار نقطه‌ای برای ابتدای طیف یعنی طول موج 315 نانومتر نشان می‌دهد. اگر چه تمام نقاط پرتو در دیسک ایری قرار نگرفته‌اند؛ ولی چون شعاع RMS کوچک‌تر از شعاع دیسک ایری است و بیشتر نقاط داخل دیسک ایری قرار گرفته‌اند؛ لذا نتیجه قابل قبول است.



شکل(۴): نمودار نقطه‌ای برای طول موج مرکزی باند UVA

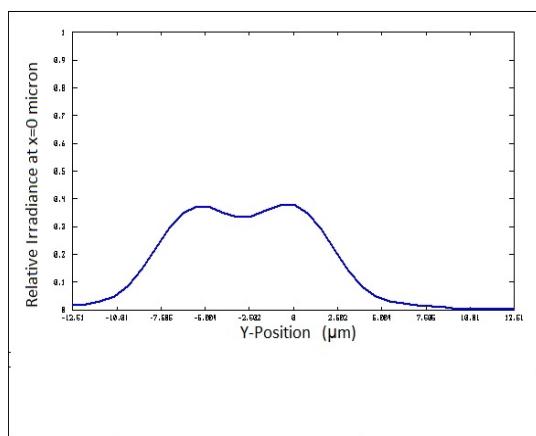


شکل(۵): نمودار نقطه‌ای برای طول موج ابتدای باند UV-A

شکل (۶) تابع انتقال مدولاسیون^(MTF) را به عنوان تابعی از فرکانس فضایی برای طول موج مرکزی توصیف می‌کند.. در سیستم نوری ایده‌آل جبهه امواج نوری گسیل شده از جسم بدون هیچ انحرافی منتقل می‌شود. اما در هر سیستم نوری واقعی محدودیتی برای دیافراگم وجود دارد و دیافراگم باعث ایجاد پراش می‌شود که MTF را کاهش می‌دهد. در این شکل محورافقی

نسبتاً گسترده، چگالی نسبتاً کم شیارهای توری و عدم مطلوب تصحیح ابیراهی‌ها بر روی آشکارساز باشد. طبق آنچه در مقاله ذکر شده است شعاع نمودار نقطه‌ای که دقیقاً مشخص نشده است منظور شعاع RMS یا شعاع هندسی است، ۰,۰۸ میلی‌متر است که مقدار بزرگی است و نشان‌دهنده این است که پرتوها را روی صفحه تصویر به خوبی کانونی نشده‌اند. در طراحی ما شعاع RMS و شعاع هندسی از مرتبه میکرون می‌باشند که نشان می‌دهد به نحو مطلوبی پرتوها در هر طول موج کانونی شده‌اند.

باقری یزد آبادی و همکارانش [۳۰] در سال ۲۰۱۷ نرم افزار زیمکس و به کمک توری پراش ۱۲۰۰ خط بر میلی‌متر و یک آینه مقعر با فاصله کانونی ۷۰ میلی‌متر، یک طیفسنج اپتیکی در طول موج مرکزی ۷۸۰ نانومتر طراحی کردند. در این کار اگر چه دقیقاً محدوده طول موج نور ورودی طیفسنج مشخص نشده است ولی قدرت تفکیک بدست آمده برای طول موج مرکزی ۷۸۰ نانومتر برابر ۰,۰۴ نانومتر ذکر شده است. اگر چه طول موج مرکزی آن طراحی بزرگتر از طول موج مرکزی در این شبیه‌سازی است ولی به هر حال سیستم طراحی شده در این کار دارای توان تفکیک بهتر ۰,۰۳۰ نانومتر است. ضمناً چون پراکندگی نور در طول موج‌های پایین تر بیشتر از طول موج‌های بالاتر است لذا بهینه‌سازی و بدست آوردن توان تفکیک مطلوب تر برای طول موج‌های پایین تر مشکل‌تر است.



شکل (۷): نمودار پهن شده‌گی نقطه‌ای PSF بر حسب مکان در صفحه تصویر در راستای محور y

۵- نتیجه‌گیری

یک اسپکترومتر با توان تفکیک بالا با مقدار ۳۰/۵۱ پیکومتر در ناحیه فرابینفس نزدیک طراحی شد. در طراحی جهت موازی‌سازی نور ورودی به توری پراش از یک عدسی دوتایی سلیکا با فاصله کانونی جلویی ۴۳ میلی‌متر ساخته شده توسط کمپانی اپتوسیگما استفاده شد. توری استفاده شده جهت

۳۵۷/۷۸ نانومتر را وارد می‌کنیم و سپس نمودار پهن شدگی نقطه‌ای PSF را رسم می‌کنیم (شکل ۷). این نمودار نشان می‌دهد که دو قله تقریباً در صفر و -۵/۹ از هم قابل تشخیص می‌باشند که از آن صحت محاسبات انجام شده برای مقدار توان تفکیک به دست آمده، نتیجه می‌شود [۲۸].

۴- مقایسه با طراحی‌های مشابه

باتوجه به اینکه داده‌های تجربی برای این نوع اسپکترومتر در دسترس نیست؛ لذا سیستم طراحی شده را با کارهای مشابه قبلی محققان مقایسه می‌شود. اطلاعات هیچ نوع طیفسنج اپتیکی که دقیقاً در پهنهای باند شبیه‌سازی شده در این مقاله باشد، در دسترس نیست؛ لذا با سایر سامانه‌هایی که عموماً دارای پهنهای باند بزرگ‌تری هستند؛ ولی به طور کامل با تا حدی این پهنهای باند را شامل می‌شوند و یا با طراحی‌هایی که شبیه این کار با نرم‌افزار زیمکس انجام شده است مقایسه می‌شوند.

اسپکترومتر طراحی شده توسط ریزبرگ و همکارانش [۲۰] که در مقدمه به آن اشاره شد دارای حجم حدود ۳۰۰ سانتی‌متر مکعب و توان تفکیک ۱,۲ نانومتر است. در طراحی ما ابعاد سیستم اسپکترومتر بر حسب میلی‌متر $112 \times 86 \times 27$ هستند و بنابراین حجم آن حدود ۲۶۰ سانتی‌متر مکعب است و توان تفکیک آن نیز همان‌طور که در قسمت قبل بررسی شد حدود ۳۰ پیکومتر است؛ بنابراین طراحی ما نسبت به این اسپکترومتر دارای توان تفکیک بهتر بوده و همچنین حجم کمتری اشغال می‌کند. ولی باید توجه داشت که کاربرد این طراحی در ناحیه طیفی ۴۰۰-۳۱۵ نانومتر است در صورتی که اسپکترومتر ریزبرگ و همکارانش برای محدوده طیفی ۶۷۵-۲۴۰ نانومتر طراحی شده است که البته هر چه پهنهای باند مشکل‌تری خواهد بود. ریزبرگ و همکارانش جهت طراحی از توری پراش و تعدادی آینه‌های میکروالکترومکانیکی استفاده کردند؛ ولی جزئیات دقیقی در مورد نحوه طراحی و مشخصات فنی قطعات استفاده شده مانند تعداد آینه‌های به کاررفته و چگالی شیارهای توری پراش ارائه ندادند.

مودادر و همکارانش [۲۹] در سال ۲۰۲۲ با کمک زیمکس و به‌وسیله یک توری پراش با چگالی ۶۰۰ خط بر میلی‌متر و دو آینه مقعر برای پهنهای باند ۷۷۰-۳۸۰ نانومتر یک طیفسنج اپتیکی طراحی کردند که توان تفکیک آن در قسمت فرابینفس نزدیک (در طول موج ۳۸۰ نانومتر) مقدار ۳۹ نانومتر اعلام کردند که دقت آن به طور قابل ملاحظه‌ای از این طراحی کمتر است. دلیل قدرت تفکیک پایین آن طراحی می‌تواند پهنهای باند

- Astronomical Instrumentation, World Scientific, pp. 159-175 2021.
https://doi.org/10.1142/9789811203770_0007
- [11] V. V. Abrameshin, Y. B. Grudzino, A. I. Shmidt, V. I. Fokin, and E. A. Sukhanov, "A Device that uses the UV Region to Detect and Photographically Record Fingerprints at an Event site," *J. Opt. Technol.*, vol. 80, no. 4, pp. 256-258, 2013. <https://doi.org/10.1364/JOT.80.000256>
- [12] J. Roberts, A. Power, J. Chapman, S. Chandra, and D. Cozzolino, "The use of UV-Vis Spectroscopy in Bioprocess and fermentation Monitoring," *Fermentation*, vol. 4, no. 1, p. 18, 2018. <https://doi.org/10.3390/fermentation4010018>
- [13] H. Lyu, N. Liao, H. Li, and W. Wu, "High Resolution ultraviolet Imaging Spectrometer for latent Image Analysis," *Opt. Express*, vol. 24, no. 6, pp. 6459-6468, 2016. DOI: 10.1364/OE.24.006459
- [14] F. G. France, "Advanced Spectral Imaging for Noninvasive Microanalysis of cultural Heritage Materials: Review of Application to Documents in the US Library of Congress," *Appl. Spectrosc.*, vol. 65, no. 6, pp. 565-574, 2011. DOI: 10.1366/11-06295
- [15] <https://felixinstruments.com/blog/Spectrophotometry-in-2021/>
- [16] <https://www.exedr.com/Blog/Spectrometer-vs-spectrophotometer/>
- [17] <https://Socratic.org/Questions/what-is-Difference-Between-Spectrophotometry-and-Spectroscopy>
- [18] S. Khan, D. Newport, and S. Le Calvé, "Gas Detection using Portable Deep-UV Absorption Spectrophotometry: A Review," *Sensors* (Basel, Switzerland), 28-Nov-2019. [Online]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/Articles/PMC6929016/>.
- [19] S. K. Amar, S. Goyal, A. K. Srivastav, D. Chopra, and R. S. Ray, "Combined effect of Benzophenone-2 and ultraviolet Radiation Promote Photogenotoxicity and Photocytotoxicity in Human keratinocytes," *Regul. Toxicol. Pharmacol.*, vol. 95, pp. 298-306, 2018. DOI: 10.1016/j.yrtph.2018.04.003
- [20] R. Riesenber, G. Nitzsche, A. Wuttig, and B. Harnisch, "Micro Spectrometer and MEMS for space," in Smaller Satellites: Bigger Business?, Springer, pp. 403-406, 2002. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-3008-2_58
- [21] W. Guodong, X. Guo, L. Zhiyuan, H. Mingyong, and L. Hongbo, "Design and key Technology Research of Portable UV-VIS Spectrometer," *Opto-Electronic Eng.*, vol. 45, no. 10, pp. 180191-180195, 2018. DOI: 10.12088/oee.2018.180195
- [22] S.-H. Oh, K.-D. Ahn, and H. Choi, "Fabrication of Integrated Spectrometer Module Based on Optical Waveguide Platform with Planar Nano Diffraction grating Using UV Imprint lithography," *Microelectron. Eng.*, vol. 217, p. 111130, 2019.
- [23] <https://support.zemax.com/hc/en-us/Articles/1500005578762-How-to-Build-a-Spectrometer-Theory>
- [24] E. G. Loewen and E. Popov, *Diffraction Gratings and Applications*. CRC Press, 2018.
- [25] J. M. Geary, "Introduction to Lens Design With Practical ZEMAX® Examples. Willmann-Bell," Inc., Richmond, 2002 ISBN: 978-0943396750
- [26] W. J. Smith, *Modern Optical Engineering*. Tata McGraw-Hill Education, 2008. ISBN: 9780071476874
- [27] P. F. Meilan and M. Garavaglia, "Rayleigh Resolution Criterion for light Sources of Different Spectral Composition," *Brazilian J. Phys.*, vol. 27, pp. 638-643, 1997. DOI: 10.1111/12.294397
- [28] <https://Support.zemax.com/Hc/En-us/Articles/1500005578862-How-to-build-a-Spectrometer-Implementation>

جداسازی طول موج های تابش ورودی دارای چگالی شیار ۳۶۰۰ خط بر میلیمتر و شبیه زیرلایه آن کوارتز در نظر گرفته شد. برای کانونی سازی طول موج های مجزا در صفحه آشکارساز از هشت عدسی همگرا از جنس سلیکا و سلیکای ذوب شده به طور یک در میان استفاده شد. عدسی ها ابتدا دو کوش با ضخامت ۳ میلی متر و فاصله جدایی ۱ میلی متر در نظر گرفته شد؛ ولی در فرایند بهینه سازی شعاع انحنای سطوح عدسی ها و همچنین فاصله جدایی عدسی ها تغییر کرد. بررسی ما پس از بهینه سازی سامانه نشان داد که سامانه دارای کنتراست و قدرت تفکیک بالایی است و نسبت به طراحی های سایر محققان که در سایر نواحی طیف الکترومغناطیسی انجام شده است نتیجه مطلوبی است. چنانچه سطوح عدسی ها را غیر کروی در نظر می گرفتیم در فرایند بهینه سازی نتایج بهتری حاصل می شد؛ ولی از آنجایی که ساخت عدسی های غیر کروی مشکل تر است و باید هزینه و وقت بیشتری صرف شود؛ لذا سطوح همه عدسی ها کروی در نظر گرفته شد.

۶- مراجع

- [1] F. Grandmont, L. Drissen, and G. Joncas, "Development of an Imaging Fourier Transform Spectrometer for Astronomy," in *Specialized Optical Developments in Astronomy*, vol. 4842, pp. 392-401, 2003. DOI: 10.1117/12.457339
- [2] P. Gatkine, S. Veilleux, and M. Dagenais, "Astrophotonic Spectrographs," *Appl. Sci.*, vol. 9, no. 2, p. 290, 2019. <https://doi.org/10.3390/app9020290>
- [3] D. C. Price, "Spectrometers and polyphase filterbanks in Radio Astronomy," in *The WSPC Handbook of Astronomical Instrumentation: Volume 1: Radio Astronomical Instrumentation*, World Scientific, pp. 159-179, 2021. https://doi.org/10.1142/9789811203770_0007
- [4] C. Baker, "The Design and Construction of High-Resolution Spectrometers for Exoplanet Discovery and Characterisation." Queen Mary University of London, 2020. <https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/71805>
- [5] B. Henderson and G. F. Imbusch, *Optical Spectroscopy of Inorganic Solids*, vol. 44. Oxford University Press, 2006. ISBN: 9780199298624
- [6] J. R. Albani, *Principles and Applications of fluorescence Spectroscopy*. John Wiley & Sons, 2007. DOI: 10.1002/9780470692059
- [7] B. C. Wilson, M. Jermyn, and F. Leblond, "Challenges and Opportunities in Clinical Translation of Biomedical Optical Spectroscopy and Imaging," *J. Biomed. Opt.*, vol. 23, no. 3, p. 30901, 2018. DOI: 10.1117/1.JBO.23.3.030901
- [8] M. Baranska, *Optical Spectroscopy and Computational methods in biology and Medicine*, vol. 14. Springer Science & Business Media, 2013. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-7832-0>
- [9] R. Richards-Kortum and E. Sevick-Muraca, "Quantitative Optical Spectroscopy for Tissue Diagnosis," *Annu. Rev. Phys. Chem.*, vol. 47, no. 1, pp. 555-606, 1996. DOI: 10.1146/annurev.physchem.47.1.555
- [10] D. C. Price, "Spectrometers and Polyphase Filterbanks in Radio Astronomy," in *The WSPC Handbook of Astronomical Instrumentation: Volume 1: Radio*

- [29] M. Naeem, T. Imran, M. Hussain, & Bhatti, A. S. . Design Simulation and Data Analysis of an Optical Spectrometer, Optics and photonics, 2022.
DOI:10.20944/preprints202207.0094.v1
- [30] A. Bagheri Yazdabadi, M. Nazeri, A. Sajedi Bidgoli and Milad Kolahi, " Design and Construction of a Spectrometer With 0.04 nm Resolution at 78 nm Central Wavelength,"23rd Iranian Conference on Optics Photonics and 9th Conference on Photonics Engineering and Thechnology Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2017 (in Persian).
<http://opsi.ir/article-1-1367-en.html>